

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2 θ (°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ: $|\Delta(\text{LogI})|$

最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数

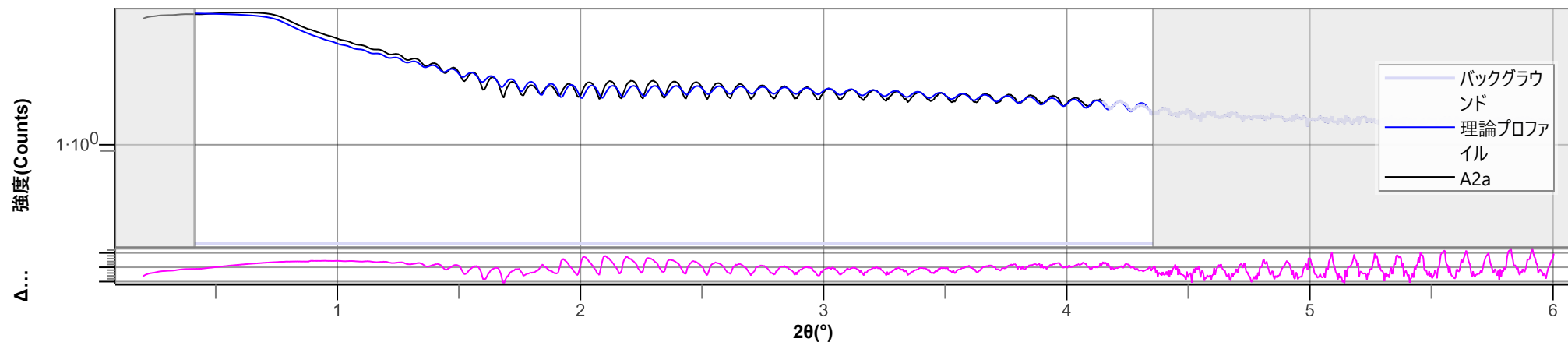
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	0.104 Const ±0.08 精密化	2.50460 Const	0.159 Con... ±0.03 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe2O3	2.473 Const ±0.05 精密化	4.95000 Const	0.100 Con... ±0.03 最小一 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	92.363 Const ±0.04 一最大 精密化	7.87400 Const	0.451 Con... ±0.013 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	1.197 Const ±0.13 精密化	4.64975 Const ±0.05 精密化	0.100 Con... ±0.03 最小一 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	